

散乱内電界効果を考慮した1次元半導体の電子輸送解析

Electron Transport in One-dimensional Semiconductor with Intracollisional Field Effect

阪大院工 ○牧平 真太郎, 森 伸也

Osaka Univ. ○Shintaro Makihira, Nobuya Mori

E-mail: {makihira, mori}@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp

GaNなどのワイドギャップ半導体が数 MV/cm と高い絶縁破壊電界をもつことから, パワーデバイス応用に向けて期待されている. 印加電界数 MV/cm 程度においては, 散乱中にキャリアが電界によって加速される, 散乱内電界効果(ICFE)が重要な役割を演じる. このICFEを考慮可能な輸送方程式として, Barker-Ferry方程式(BF方程式)[1]がある. BF方程式は, エネルギー保存則に相当する項をローレンツ関数などに近似して, 解かれてきた[2-5]. 本研究では, そのような近似を導入せず, 1次元系に関する定常状態のBF方程式を解くことを試みた.

電界 F のもとでの, フォノン散乱のみを考慮した, 定常状態の1次元BF方程式は,

$$\frac{eF}{\hbar} \frac{\partial f(k)}{\partial k} = \int_{-\infty}^0 dt' \sum_{\eta=\pm 1, k'} \{S_{\eta}(k, k'; t') f(k'(t')) - S_{\eta}(k', k; t') f(k(t'))\}$$

と表せる. ここで, η はフォノン吸収・放出を表す指数, $S_{\eta}(k, k'; t')$ はメモリー効果を考慮したフォノン遷移割合, $k(t') = k + t'eF/\hbar$ である. この式は, 波数軸の刻み幅 Δk と時間軸の刻み幅 Δt との間に, $\Delta k = (eF/\hbar)\Delta t$ なる関係が成り立つようにして離散化すると, 固有値0の固有値問題に帰着される. 本研究では, その固有値方程式を解き, 定常状態の分布関数 $f(k)$ を求めた. その際, 簡単化のため, 余弦バンド(バンド端の有効質量が $0.2m_0$, 格子定数が 0.5 nm)を有する1次元系を考え, フォノンエネルギーが $\hbar\omega_0 = 100\text{ meV}$, 行列要素が定数であるフォノン散乱を考慮した.

図1に電子の分布関数を示す(右図と左図は, 横軸の範囲が異なる). 実線がBF方程式を解いて求めた結果であり, 比較のため, 点線にボルツマン輸送方程式を解いて求めた結果をプロットした. ボルツマン輸送方程式の場合, 1次元系特有のフォノン放出確率の発散により, $E = \hbar\omega_0$ にキックが現れるが, BF方程式の場合, フォノン放出の閾値がぼけるため, そのようなキックが現れない. また, BF方程式の場合, バンド内全体に渡り, 電子が広く分布している様子も分かる.

[1] Barker & Ferry, PRL **42**, 1779 (1979). [2] Ferry & Barker, J. Phys. Chem. Solids **41**, 1083 (1980). [3] Reggiani *et al.*, JAP **64**, 3072 (1988). [4] Sano & Natori, PRB **54**, R8325 (1996). [5] Kuivalainen, Physica Scripta **61**, 373 (2000).

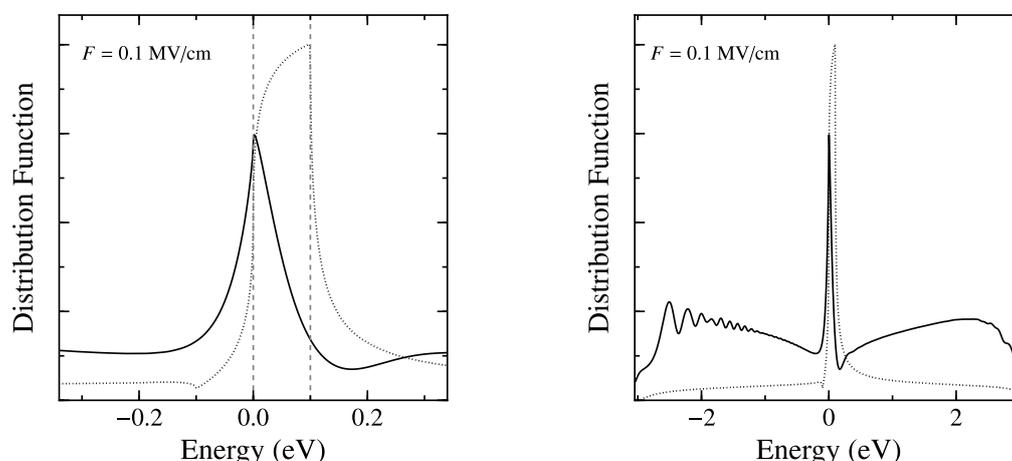


Fig. 1: Distribution function, f , calculated by the Barker-Ferry equation (solid line) including a collisional broadening with $\tau_{\Gamma} = 10\text{ fs}$. Dotted line shows f calculated by the Boltzmann transport equation.